CaF₂/ Si ヘテロ構造を用いた近赤外波長量子カスケードレーザの低電界化 に向けた構造提案

Active layer desings for near-infrared wavelength quantum cascade lasers using CaF₂/ Siheterostructure for electric field reduction

東工大工学院 〇 杉山 裕太、鈴木 飛雄馬、范 志遠、渡辺 正裕 Tokyo Tech, Yuta Sugiyama, Hyuma Suzuki,Zhiyuan Fan, Masahiro Watanabe E-mail: sugiyama.y.ao@m.titech.ac.jp

【はじめに】 シリコン (Si) 量子井戸中のにおけるサブバンド間遷移を誘導放出・光増幅の基本原理とする量子カスケードレーザ (QCL) は、Si 集積回路技術との高い親和性を持ち、シリコンフォトニクス用光源としての可能性を有している.

Si 系 QCL の実現に向けて、本研究では量子 井戸障壁材料にフッ化物系絶縁体の CaF_2 を採 用している。理由は CaF_2 は Si との格子不整合 が 0.6%と小さく、伝導帯不連続 (ΔE_c) が 12.3eV と大きく、シリコンフォトニクスを意識し た近赤外波長をもカバー可能な QCL の設計に 有利な材料といえる。[1]

 CaF_2/Si による近赤外波長帯 QCL について,我々は今までに $1.65 \mu m$, $1.70 \mu m$ の量子井戸活性層の設計例を電流注入発光特性とともに報告してきた [2,3]. 今回はこれまでの設計に対して,注入層の井戸数を増やすことで低電界化を狙った $1.76 \mu m$ の量子井戸活性層の設計例を提案し,反転分布形成の可能性について,サブバンド内・間散乱時間,共鳴トンネル時間の観点から検討を行ったので報告する.

【素子構造・活性層設計】Fig.1 に電圧印加時の提案する CaF_22 / Si 活性層バンドプロファイル及び遷移に関与する波動関数の確率密度分布を示す。Fig.1 より活性層は,注入層・遷移層・引抜層及び遮断層・緩和層の 4 層・5 領域による 1 周期で構成され,複数周期を積層する構造となっている。そしてこの遷移層の遷移波長は 1.76 μ mである。また緩和層の材料は n 型 Si であり,フリーキャリア吸収損失としきい値電流密度のトレードオフを考慮して 1×10^{19} cm $^{-3}$ (0.93 nm)

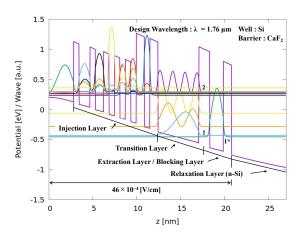


図 1: CaF₂/Si 活性層バンドプロファイル

と 1×10^{18} cm⁻³(8.37 nm) で構成されている.

提案構造は活性層に印加される電界の低電界化をねらっており、提案構造の注入層を7つの障壁によって構成させることでこれを達成している。注入には各量子井戸の基底準位を介したトンネル伝導を想定した。先行研究(設計波長1.65 μ m)の81×10⁻⁴ V/cm に対して、提案構造では、 46×10^{-4} V/cm² と 57% 程度に低減可能であることが分かった。

【反転分布形成】Si 量子井戸構造中のフォノン 散乱によるサブバンド間散乱 (準位 $2 \leftarrow 1$),及 び共鳴トンネルのブロードニングを伴う電子引 き抜き (準位 $1 \leftarrow 1^*$) を想定し散乱時間 $\tau_{21} \cong$ $\tau_2 = 0.63$ ps, $\tau_1 = 0.31$ ps と概算した.以上の ことから,反転分布条件 ($\tau_{21} > \tau_1$) を満足して るサブバンド設計であると結論できる.

【参考文献】

- [1] G.Tei et al., Jpn. J. Appl. Phys. 60 SBBE03 (2021)
- [2] 鄭他,春季第83回応用物理学会,22p-P05-1 (2022).
- [3] 斎藤他, 春季第 65 回応用物理学会, 19-P9-2 (2018).